(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-110726 (P2002-110726A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			Ť	·-マコード(参考)
H01L	21/60			H01I	21/60		311S	5 F O 4 4
		3 1 1			21/92		602D	
							602G	
							602R	
							603A	
			審查譜求	有 葡	水項の数24	OL	(全 9 頁)	最終百に続く

(21)出願番号 **特顧2000-304708(P2000-304708)**

(22)出願日 平成12年10月4日(2000.10.4)

(出願人による申告) 国等の委託研究の成果に係る特許 出願(平成11年度新エネルギー・産業技術総合開発機構 「超高密度電子SI技術の研究開発エネルギー使用合理 化技術開発」に関する委託研究、産業活力再生特別措置 法第30条の適用を受けるもの)

(71)出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(71)出顧人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(71)出顧人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

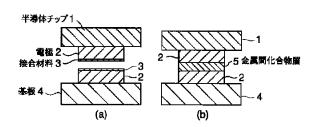
(74)代理人 100071272

弁理士 後藤 洋介 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57)



(2)

(3)

(4) 5

--

10

20

30

40

(5)

(6)

9 10

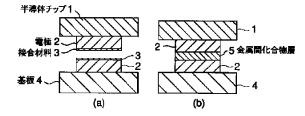
()

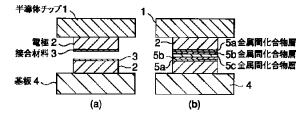
11 12

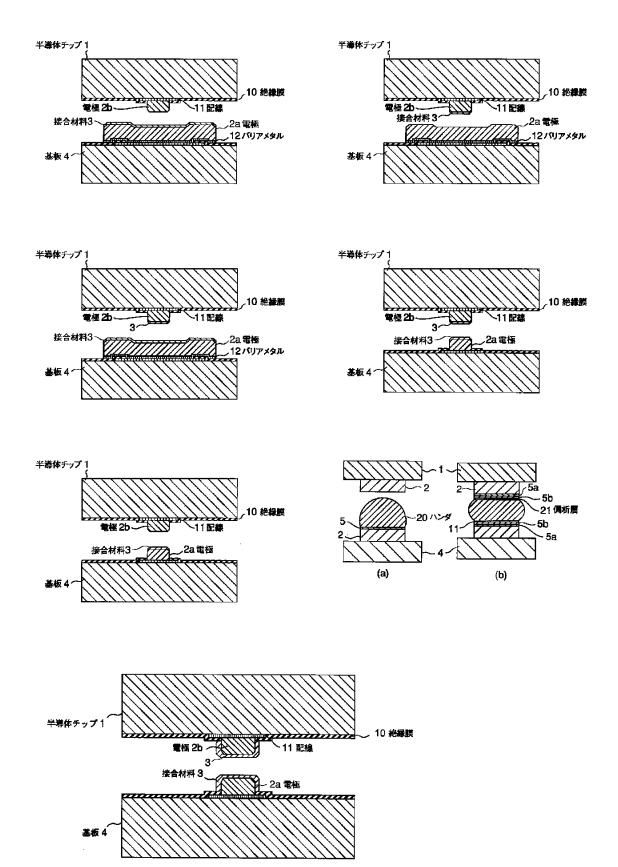
(7)

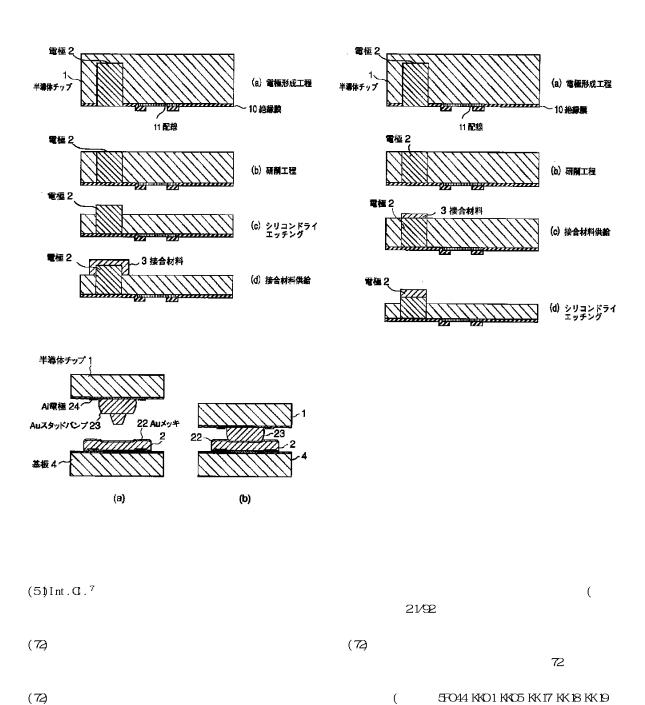
10

20









ЦОБ QQQ2 QQQ3 QQQ4 RRC2